

Совещание четвертого комитета МКРЗ

С 1 по 6 декабря 1975 г. в Москве проходило очередное совещание четвертого комитета Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), в работе которого участвовали 9 из 13 его членов. Единственным вопросом, обсуждавшимся на этом совещании, был проект Публикации № 29. В ней предусматривается изложить подход Комиссии к нормированию уровней облучения профессиональных работников и населения. Предполагается, что новая Публикация МКРЗ будет одобрена Главной комиссией в 1976 г. и издана в 1977 г. издательством «Пергамон Пресс» на английском языке.

Совместное заседание Национальной комиссии по радиационной защите при Минздраве СССР и четвертого комитета МКРЗ, состоявшегося 6 декабря 1975 г., прошло в деловой и дружеской обстановке.

В Москве зарубежные участники совещания посетили Радиологический Центр центрального института усовершенствования врачей. Большая группа ученых выезжала в Ленинград, где она ознакомилась с основ-

ными направлениями работ по радиационной безопасности Ленинградского научно-исследовательского института радиационной гигиены.

Во время пребывания зарубежных ученых в СССР состоялись встречи и беседы ведущих ученых нашей страны с Председателем четвертого комитета МКРЗ А. Жамме, Ученым секретарем научного комитета ООН по действию атомной радиации Д. Бенинсоном и начальником отдела радиационной медицины Всемирной организации здравоохранения В. Зеелентагом. Во время этих встреч и бесед обсуждались перспективы дальнейшего развития научных исследований в области радиационной защиты, участия советских специалистов в работе Международной ассоциации по радиационной защите и четвертого Международного конгресса по радиационной защите, который будет проведен Международной ассоциацией в апреле 1977 г. во Франции (г. Париж).

МОИСЕЕВ А. А.

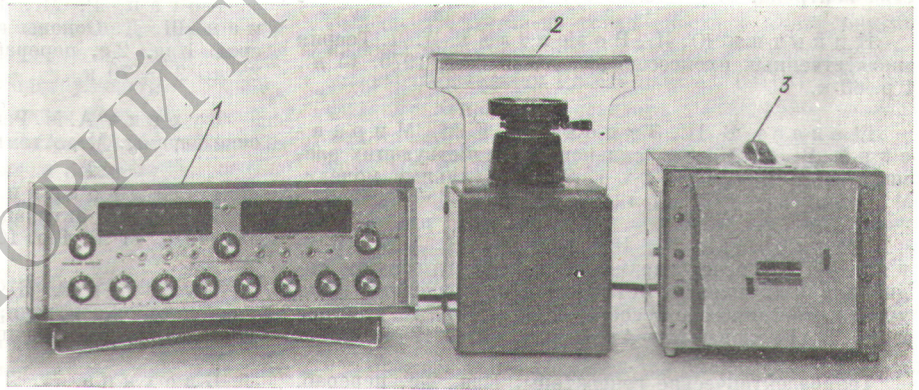
Радиоизотопный толщиномер двухслойных покрытий «Бета-микрометр-3»

Во ВНИИРТе изготовлены производственные образцы радиоизотопного прибора «Бета-микрометр-3» (см. рисунок), позволяющего производить бесконтактное неразрушающее измерение толщины двухслойных металлических и неметаллических покрытий сложной конфигурации (в виде рисунка) на малогабаритных хрупких металлических и неметаллических изделиях с минимальной площадью контроля 0,25 мм². «Бета-микрометр-3» создан на базе ранее разработанных приборов «Бета-микрометр» и «Бета-микрометр-2» [1, 2]. В отличие от первых двух модификаций прибор снабжен тремя сменными источниками β-излучения с широким диапазоном граничных энергий. Для выбора оптимального источника при контроле заданного сочетания материалов покрытий и подложки была разработана методика учета влияния вариации толщины слоя, расположенного выше или ниже контролируемого.

Измерять толщину покрытий сложной конфигурации позволяет визир-держатель. Наводка на выбранную область измерения производится при помощи координатного механизма.

Схема первичного преобразователя ДОТ-3 выполнена на интегральных микросхемах, что существенно повысило надежность прибора. Время измерения регулируется масштабными переключателями и может быть в зависимости от требуемой точности контроля установлено от 1 до 1000 с. Прибор «Бета-микрометр-3»

имеет выход на цифрочитающее устройство БЗ-15. При совместной работе с БЗ-15 результат измерения печатается на бумажной ленте: в первом столбце — порядковый номер замера, во втором — показания табло прибора. Прибор питается от сети, 220 В



Толщиномер двухслойных покрытий «Бета-микрометр-3»:

1 — пересчетное устройство ПУ-2; 2 — первичный преобразователь ДОТ-3; 3 — цифрочитающее устройство БЗ-15

50 Гц; потребляемая мощность не более 100 ВА. Рабочий диапазон 10—35 °С.

КРЕЙНДЛИН И. И., НОВИКОВ В. С., ПРАВИКОВ А. А., РУБАШЕВСКИЙ И. Р.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крейндли И. И., Новиков В. С., Правиков А. А. «Атомная энергия», 1971, т. 30, вып. 5, с. 47.
2. Зверева Т. Г. и др. «Атомная энергия», 1974, т. 36, вып. 5, с. 413.